

# 8935

高產能的圖案晶圓檢測系統，在半導體晶片上偵測影響良率和可靠性的關鍵缺陷

## 優勢：

8935以其高效的產量、線上缺陷檢測和分類可以協助汽車晶片製造商：

- 準確識別并快速解決可能影響最終晶片品質的生產製程問題
- 在關鍵製程步驟中對所有晶圓上的100%的晶片實施監控以實現零缺陷篩選策略，在成本最低的供應鏈源頭就剔除可能發生故障的晶片
- 採用這個可擴展、經濟高效的平台生產新元件和轉向更小的設計節點，該平台的檢測靈敏度和 AI 技術可以檢測發現關鍵缺陷，同時其產量可用於監控和篩選的應用

## 技術：

- 使用高數值孔徑光學系統的多模式LED掃描功能
- 高解析度操作模式
- DefectWise® 人工智能缺陷檢測和分類技術
- DesignWise™ 和 FlexPoint™ 精確區域檢測技術
- 先進的噪聲抑制算法
- I-PAT® 在線篩選解決方案

## 應用：

- 線上製程監控，針對批次和晶圓進行高採樣檢測以降低偏移風險
- 製程設備監控
- 圖案晶圓的最終出廠品質控制
- 採用I-PAT的全自動晶片級篩選解決方案



## 市場：

用於汽車、物聯網、5G、消費電子、工業（軍事、航空、醫療）的較大設計節點元件的晶片製造

## 平台：

- 可定制的配置
- 可擴
- 可升級

## 晶圓尺寸：

- 300mm
- 200mm
- 150mm

## 更多资讯：

[www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review#product-8-series](http://www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review#product-8-series)